溶接施工条件での水素濃度測定の重要性

(平成元年5月27日 原稿受付)

 材料工学科(学生)
 遠
 矢
 正
 男

 物質工学科(材料コース)
 秋
 山
 哲
 也

 物質工学科(材料コース)
 寺
 崎
 俊
 夫

Importance of Hydrogen Content Measured under Welding Conditions in the Field

by Masao Touya Tetsuya Akiyama Toshio Terasaki

Abstract

This paper has investigated that the hydrogen content just after welding is influenced by welding conditions in spite of the similar electrode. Implant tests were done for proving the change of hydrogen content due to welding conditions. The susceptibility of cold cracking changed by welding conditions. It was clear from data of Implant test that the hydrogen content must be measured under the welding condition used in the field for avoiding cold cracking.

1. 緒 言

著者らは溶接割れの重要因子である水素濃度を精度良 く測定する試験片寸法を理論と実験により明らかにし た1)・2)。従来の規格では、水素濃度測定用の試験片は 固定された溶接条件での水素濃度の測定に対してのみ有 効であり,単に溶接棒が保有している水素濃度の比較試 験にしか利用できない欠点を持っていた³⁾。著者らは溶 接金属が保有する水素濃度が溶接条件により変化する事 を実験により示した $^{2)}$ 。そして、低温割れ防止に使用で きる水素濃度は溶接施工条件で測定しなければならない 事を指摘し, 多くの施工条件下で水素濃度が測定できる 試験片寸法として板厚12mm, 板幅40mm, 板長40mmの 試験片を提案した。しかし、溶接金属が保有する水素濃 度が溶接条件で変化することを示した報告は著者らの データ以外には存在せず、"溶接施工条件での水素濃度 測定の重要性"を指摘する研究が必要となった。溶接低 温割れは応力、割れ発生部の組織 (硬さで代表される),

水素濃度の影響を大きく受ける。従って、溶接施工条件により水素濃度は変化するが、水素濃度以外の2つの因子である応力と硬さが変化しない溶接割れの実験を行えば、溶接施工条件での水素濃度の測定の重要性が証明される。また、著者らが提案した水素濃度測定用の試験片寸法の意義が明確になる。

本論文では溶接施工条件で水素濃度を測定しなければならない重要性を明らかにするために、応力の制御が容易なインプラント試験を使用して、溶接割れの実験を行った。同じ溶接棒を使用しても溶接条件が異なると水素濃度が変化することを明らかにすると共に、水素濃度の影響によりインプラント試験の割れ限界応力が異なることを明らかにした。

2. 水素濃度に関する実験

溶接棒が同じでも溶接施工条件が異なると水素濃度が 変化することを実験により明らかにする。

2.1 実験材料

水素濃度の測定には表-1に示す溶接用構造用鋼 SM50を使用した。溶接棒として50キロ級高張力鋼に用 いられる低水素系溶接棒 D5016を使用した。溶接棒の 乾燥条件は300℃、1時間である。

表-1 水素濃度測定用試験片の化学組成

Steel	Chemical compositions (wt%)								
Steel	С	Si	Mn	P	S				
SM50	.16	.44	1.36	.021	.009				

2.2 実験方法

溶接は写真-1に写真を示す完全自動被覆アーク溶接機で行った。この溶接機は写真-2に写真を示すようにアーク電圧制御で自動溶接を行っている。前報²⁾で報告したように溶接電圧が変化すると溶接金属が保有する水素濃度が変化するため、溶接条件としては溶接電流170A、溶接速度150mm/minと一定にして、溶接電圧のみを25V、20Vと変化させた。図-1に電圧波形を示すように溶接中の平均電圧は25Vと20Vのほぼ一定値に成っている。

水素捕集は提案した12×40×40の試験片を用いて行った。水素捕集の手順を図ー2に示す。水素捕集用のピースとタブ板を図(a)のように Cu ブロックの溝に配置し、

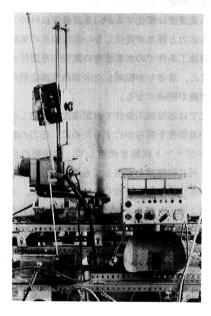


写真-1 完全自動アーク溶接機

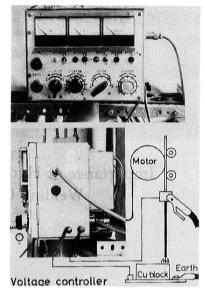


写真-2 溶接電圧制御部

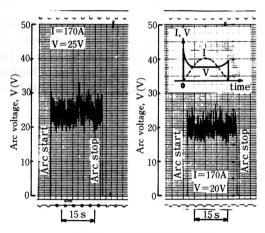


図-1 溶接電圧波形

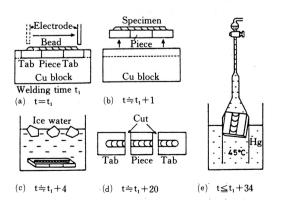


図-2 水素捕集の手順

溶接を行う。溶接に要した時間を t₁(s)とする。溶接 終了後に図(b)に示すように試験片を Cu ブロックから取 り外し、図(c)に示すように氷水に試験片を投入する。そ の後,図(d)に示すようにピースとタブ板を分離してスラ グを除去し、図(e)に示す45℃の恒温保持した水銀中のベ ル内にピースをセットする。各過程での所用時間を図中 に示している。

2.3 実験結果と考察

実験結果を表-2に示す。電圧の異なる2種類の水素 捕集の実験は表に示すように同じ日に行い、得られた水 素濃度に電圧以外の要因が含まれないようにした。

表中の記号を次に説明する。

V:水素捕集量(ml)

h_{Hg}:ベル内での水銀柱の高さ(mm)

A:溶着金属の断面積(cm²)

B: (溶接金属の断面積)-A(cm²)

W:溶着金属の重さ(g)

H_F:溶接金属当りの捕集された水素濃度

RT:室温

AP: 大気圧 (mmHg)

SP:室温における飽和水蒸気圧(mmHg) 水素濃度 H_F(ppm) は次式より求めた。

 $H_{\rm F} = 0.9 \cdot 100 / \text{W} \cdot \text{V} \cdot \{273 / (\text{RT} + 273)\}$

 $\cdot (AP-SP-h_{Hg})/760 \cdot \{A/(A+B)\}$

表-2 水素濃度の測定結果

表において同じ日付の Hr を比較すると溶接電圧が高 い25Vの水素濃度が20Vの水素濃度よりも小さいことが 分かる。

上記の二つの水素濃度に差が存在するか否かを t 検定 する⁴⁾。水素濃度の測定値は正規分布に従うと仮定する。 25 Vの測定値を $x_i(n個)$, 20 Vの測定値を $y_i(m個)$ と すると、標本平均値 x_{av} 、 y_{av} および不偏分散 s_x^2 、 s_y^2 は次に示す式の形で自由度 (n+m-2) の t 分布に従う。

$$t=(x_{\mathrm{av}}-y_{\mathrm{av}}-\mu_x+\mu_y)/\sqrt{s^2}\cdot\sqrt{nm/(n+m)}$$
ただし、 $x_{\mathrm{av}}=\left(\sum\limits_{i=1}^n x_i\right)/n$
 $s_x^2=\left[\sum\limits_{i=1}^n (x_i-x_{\mathrm{av}})^2\right]/(n-1)$
 $y_{\mathrm{av}}=\left(\sum\limits_{i=1}^m y_i\right)/m$
 $s_y^2=\left[\sum\limits_{i=1}^m (y_i-y_{\mathrm{av}})^2\right]/(m-1)$
 $s^2=[(n-1)s_x^2+(m-1)s_y^2]/(n+m-2)$
 $\mu_x:25$ Vの水素濃度の真の平均値
 $\mu_y:20$ Vの水素濃度の真の平均値

そこで、表-2のデータを用いて、25Vと20Vの水素 濃度は同じであると仮定すると $\mu_x = \mu_y$ となり,

$$x_{av}$$
=2.56 ppm s_x^2 =0.25 ppm $n=8$ y_{av} =3.35 ppm s_y^2 =0.39 ppm $m=9$ より、自由度15、t=4.8956となる。

(1) We	lding (conditio	on 170)A 25	5V 1	50mm/m	in Q=	1.7kJ/mm	l
-	V	hнg	Α	В	W	HF	RT	AP	SP	H

(-)										
V (mℓ)	hHg (mm)	A (cm²)	B (cm²)	W (g)	H _F (ppm)	RT (℃)	AP (mmHg)	SP (mmHg)	Humidity (%)	Date
.60	280 286	.290 .280	.168 .146	7.7 7.8	2.52 2.67	24	771.0	22.4	53	86.12.03
.54 .56 .58	292 309 284	.248 .235 .248	.189 .167 .166	6.2 6.4 6.4	2.52 2.51 2.82	21	774.6	18.6	53	86.12.06
.48 .47 .55	294 304 288	.219 .258 .285	.137 .160 .127	6.2 6.7 6.6	2.38 2.12 2.92	23	772.4	21.1	46	86.12.10

(2) We	lding o	onditio	n 170) A 20	OV 19	50mm/m	in Q=	1.36 kJ/ m	m	
V (mℓ)	hнg (mm)	A (cm²)	B (cm²)	W (g)	H _F (ppm)	RT (℃)	AP (mmHg)	SP (mmHg)	Humidity (%)	Date
.72 .72 .84	297 293 292	.238 .316 .345	.125 .151 .117	7.3 8.7 8.2	3.36 2.78 3.80	24	771.0	22.4	53	86.12.03
.79 .75 .70	294 288 292	.264 .314 .271	.112 .147 .143	7.0 7.5 7.2	4.03 3.51 3.25	21	774.6	18.6	53	86.12.06
.64 .60 .65	297 296 295	.305 .270 .266	.142 .105 .152	7.0 7.0 6.8	3.10 3.33 3.03	23	772.4	21.1	46	86.12.10

自由度15での有意水準0.5, 1, 5%でのt値は3.286, 2.9467. 2.1315であるから、得られた4.8956は十分に大 きい値である。従って、20Vと25Vの水素濃度は同じで あると言う仮定は危険率0.5%で棄却される。すなわち、 溶接電圧が20,25Vと異なると水素濃度も異なることに なる。

20Vの水素濃度が25Vの水素濃度よりも大きくなる原 因は明かではないが、**写真-3**にアークの写真を示すよ うにアーク柱の長さが関係しているようである。

3. 溶接割れに関する実験

溶接棒が同じであっても, 溶接条件が異なると水素濃 度が異なるため、溶接割れ感受性が変化することを実験 により明らかにする。溶接割れの3大因子は拘束応力, 熱影響部の硬さ、および水素濃度である。 インプラント 試験では拘束応力が制御できるため、割れ発生部の硬さ が等しくなるようにすれば、溶接割れ感受性に及ぼす溶 接条件の相違による水素濃度の影響が明らかになる。

3.1 実験材料

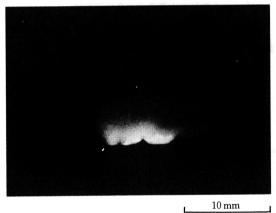
溶接施工条件が変化しても水素濃度以外の溶接割れの 主因子である熱影響部の最高硬さおよび組織が変化しな い材料として表-3に示す ASTMA387の Cr-Mo 綱を 選んだ。

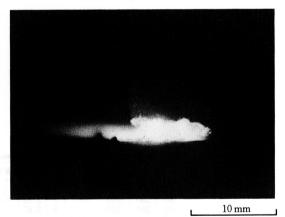
3.2 実験方法

インプラント試験は**図ー3**に示す板厚19mmのサポー トプレイトを使用し、図ー4に示す著者が考察したイン

表-3 インプラント試験片の化学組成

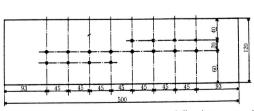
0. 1	Chemical compositions (wt%)								
Steel	С	Si	Mn	P	S	Cr	Mo		
ASTM-A387	.15	.15	.56	. 011	.004	2.39	1.09		





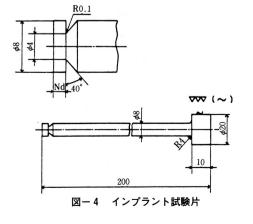
(b)溶接電圧 25 V

(a)溶接電圧 20V 写真一3 アーク



- \bigcirc Hole for implant specimen (ϕ 7.9 drill and ϕ 8.1 reamer)
- \times Hole for thermo-couple (ϕ 2.8 drill)

図-3 サポートプレート



プラント試験片を使用して行った。サポートプレイトには熱電対をセットする ∮ 2.8mmのドリル穴を設け、温度が150℃以下に冷却したときに、荷重が負荷されるようにした。荷重は死荷重で与えた。インプラント試験片の Nd 値は溶接線に沿う縦割り断面において、ボンドラインが ∮ 4mmの最小直径の位置と交差するように2.6mmとした。

3.3 実験結果

溶接電圧以外の溶接因子を同じにして、インプラント 試験を行った時の溶接熱影響部近傍の硬さ分布を図-5 に示す。溶接電圧が20V,25Vと変化しても影響部の硬 さはほぼ等しいことがわかる。写真-4に割れ発生部と なるボンド近傍の熱影響部の組織写真を示す。

写真はマルテンサイト組織を示しており、使用した溶接条件の相違は組織に影響していない。また組織に影響を与える冷却時間 t_{N} =73s より小さい事、 サイトが100%から減少する時間 τ_{N} =73s より小さい事、 およびマルテンサイト100%の硬さが Hv_{max} =415 である事より、写真 -4 の組織はマルテンサイト100%と考えられる 5)。

溶接割れ発生時(約100 \mathbb{C})の水素濃度に関連した冷却時間 t_{150} の平均値は25V で94秒, 20V で84秒であり、この差は水素の拡散にほとんど影響を与えないため、冷却時間は割れに影響しないことになる 50 。

図-6にインプラント試験の負荷応力—破断時間の実験結果を示す。破断時間が1000分を越した試験片は非破

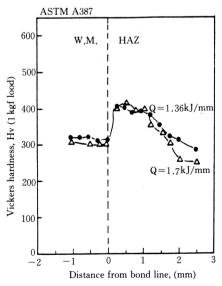
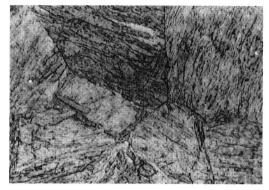
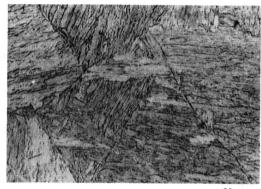


図-5 溶接熱影響部近傍の硬さ分布



(a)溶接電圧 20V

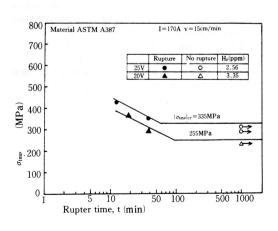
20 µm



(b)溶接電圧 25 V

 $20 \, \mu \mathrm{m}$

写真一4 熱影響部の組織



図ー6 インプラント試験結果

断試験片とした。限界応力として非破断試験片の最大応力と破断試験片の最小応力の平均値を用いた

図より

170A, 25V, 150mm/min の溶接条件では限界応力が335MPa.

170A, 20V, 150mm/min の溶接条件では限界応力が 255MPa

であり、溶接施工条件が異なると限界応力が変化している事がわかる。

4. 結論

著者らは前報²⁾において水素濃度を測定する試験片の 寸法について検討した過程において、溶接施工条件下で 水素濃度を測定する必要が有ることを指摘した。

そして、水素濃度測定試験片の寸法として多くの溶接施工条件下で溶接できる試験片寸法として、板厚12mm,板幅および板長40mmの試験片を提案した。

しかし、著者らの指摘した事柄が規格を作る上において考慮されていない。

本報告は溶接施工条件が異なると水素濃度が変化して溶接割れの条件が異なることを示すのが目的であり、インプラント試験結果は著者らの指摘したことが重要であることを示した。

参考文献

- Toshio Terasaki and Tetsuya Akiyama: An Analysis on Specimen Size for Determination of Diffusible Hydrogen Content in Weld Metal, Trans. J. W. S, Vol. 17 No. 1 1986, pp. 93-101
- Toshio Terasaki and Tetsuya Akiyama: Experimental on Specimen Size for Determination of Diffusible Hydrogen Content in Weld Metal, IIW Doc. II-1071-86
- 3) WES 1003-1984:溶接部の水素量測定方法
- 4) 和田秀三:統計入門, P.98, サイエンス社
- 5) 寺崎俊夫:溶接部の低温割れに関係する熱因子および硬度 の推定式の検討, 鉄と綱, 1981, 16号, p.2715-2723